

設計者・品質管理者のための 「機器分析技術の基礎」

日時 2017年 3月 23日(木) 10:00~17:00

主催  日刊工業新聞社

会場 日刊工業新聞社 東京本社 セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町 14-1 (住生日本橋小網町ビル)

受講料 **43,200円** (資料代含む、消費税込)
※1社複数名のご参加の場合、2人目より10%割引致します。
(38,880円)



日刊工業新聞社 東京本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋小網町14-1 (住生日本橋小網町ビル)

【アクセス】

東京メトロ日比谷線「人形町駅」A2出口 徒歩3分、都営浅草線「人形町駅」A6出口 徒歩3分
東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」8番出口 徒歩4分

●申込方法

お申し込みはWeb (<http://www.nikkan.co.jp/edu/semi/top.html>) かFAXまたは郵送にて受け付けております。申込受付後、受講票と請求書をお送りいたします。受講料は銀行振込にて開催日までに必ずお支払いください。尚、お支払い済みの受講料はご返金できかねますので、ご了承ください。振込手数料は貴社でご負担ください。

口座名義

(株)日刊工業新聞社

りそな銀行	東京営業部	当座	656007
三井住友銀行	神田支店	当座	1023771
みずほ銀行	九段支店	当座	21049
三菱東京UFJ銀行	神保町支店	当座	9000445

●申 込 先 日刊工業新聞社 業務局 イベント事業部 技術セミナー係

〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1 (住生日本橋小網町ビル)
TEL 03 (5644) 7222 FAX 03 (5644) 7215
e-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp

受講 申込書

3/23 機器分析技術の基礎

お申し込みは **FAX 03-5644-7215**

■受講料：43,200円 (資料含む、消費税込)

※1社複数名のご参加の場合、2人目より10%割引致します。(38,880円) ※振込手数料は貴社にてご負担ください。

会社名		業種	
氏名	フリガナ ----- 部署・役職	TEL	
所在地	〒	FAX	
E-mail :		※今後、E-mailによるご案内を希望しない方は チェックをしてください。 <input type="checkbox"/>	

※お申込み受付後、受講票ならびに請求書をお送りいたします。
※一度お振込みいただいた受講料につきましては、ご返金できかねますのでご了承ください。

個人情報の取り扱いについて

ご登録いただいた情報は日刊工業新聞社が細心の注意を払い、展示会・セミナー・サービス等、各種ご案内を送らせていただくことを目的に利用させていただきます。
なお、宛先変更・配信停止をご希望の際は右記までご連絡ください。【ご連絡先】日刊工業サービスセンター 情報事業部 nkmail01@nikkansc.co.jp

開催主旨

モノづくりでは、各工程において、きちんと設計通りの形で、かつ性能を発揮でき、量産可能なものができているかを評価・分析し、フィードバックさせながら開発を進めて行くことが重要です。さらに、自信を持ってフィールドに出した後、何らかの原因で思いもよらない不具合が発生することもありますので、その原因を評価・分析し、その結果をモノづくりにフィードバックして再発防止を行っていくことも重要な因子です。すなわち、モノづくりと評価・分析技術は製品を作っていく上で、車の両輪を形成するものと言えます。

本講座では、モノづくりに携わる方々が評価・分析を行う上での基礎を紹介します。具体的には、各分析手法の豊富な事例を基にどのような場面でどのような分析手法を活用すれば良いのかをやさしく紹介します。なお、本講座の事例、写真などは講師が(株)島津製作所様の全面的ご協力を得ております。また、RoHS関連分析を例として、実際の分析の流れを紹介します。

多くのモノづくりに携わる設計者・品質管理者の参加をお奨めします。

講師

T-FANS材料技術研究所 代表 **飯川 三無 氏**

【略歴】 1971年、東北大学工学部金属工学科終了。同年、大手電子機器・情報機器メーカー入社。各種機器に使用する材料の開発や材料技術・分析技術の開発に従事する。
2008年、定年退職後、T-FANS材料技術研究所を設立し、中小企業の技術コンサルティングなどを幅広く展開する。

プログラム

1. 分析とは

- 1.1 分析の定義
- 1.2 分析の手法 他

2. 形態観察法

- 2.1 走査型電子顕微鏡(SEM)
- 2.2 透過型電子顕微鏡(TEM)
(各種試料作成方法)
- 2.3 走査型プローブ顕微鏡(SPM)
- 2.4 レーザ顕微鏡(LSM)
- 2.5 マイクロフォーカスX線透視/
CT装置

3. 表面/界面分析法

- 3.1 蛍光X線分析(XRF)
- 3.2 電子線マイクロアナリシス
(EPMA)
- 3.3 オージェ電子分光分析(AES)
- 3.4 X線光電子分光分析(XPS)
- 3.5 グロー放電分光分析(GD)

4. 無機/有機分析法

- 4.1 誘導プラズマ発光分光分析
(ICP-AES)
- 4.2 フーリエ変換型赤外分光分析
(FT-IR)
- 4.3 ラマン分光分析法
- 4.4 ガスクロマトグラフ-質量分析
(GC-MS)
- 4.5 液体クロマトグラフ-質量分析
(HPLC)
- 4.6 イオンクロマトグラフ分析(IC)
- 4.7 各種熱分析(TG-DTA、TMA)

5. RoHS分析の実際

- 5.1 Cd、Pb、Hg、Cr⁶⁺の分析
- 5.2 PBB、PBDEの分析
- 5.3 フタル酸の分析
- 5.4 蛍光X線簡易分析
- 5.5 分析の精度管理

6. 分析とは(おわりに)

- 6.1 分析とは
- 6.2 故障の未然防止サイクル